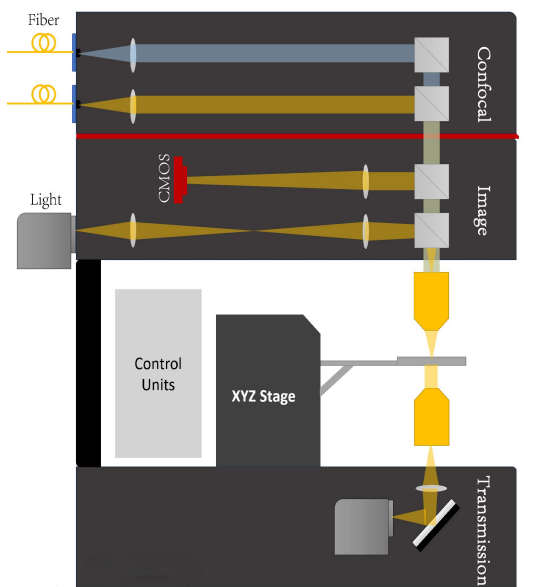


反射/透射光谱共聚焦扫描成像系统

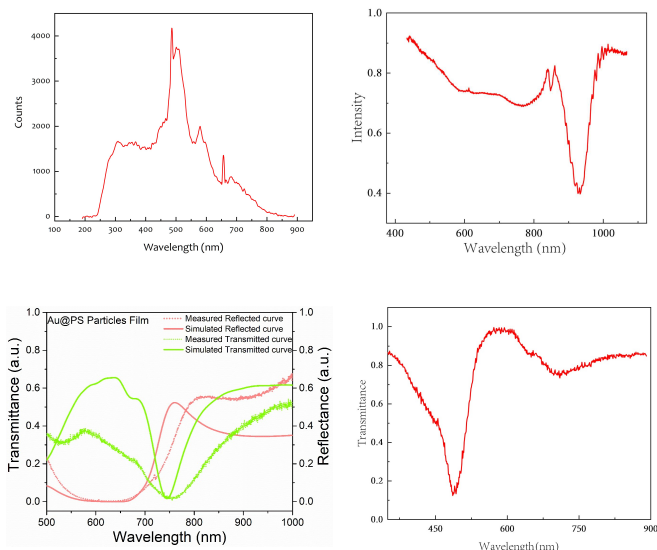
标准反射/透射光谱测试系统，采用“所见即所得”的测量方式，即反射与透射测量方式均能在直接观测样品成像时看到测量光斑，成像与测量光路通过电机切换。标准系统可满足紫外/可见/近红外波段的测试需求，对于特殊波段可进行优化设计及光路定制。

► 系统原理示意图



*此图为简化原理示意，不代表实际光路

► 典型数据图



► 典型参数配置

测试光源:	光纤耦合卤素灯；自由空间卤素灯（可选）
支持光谱范围:	250 nm - 850 nm；400 nm - 1100 nm；900 nm - 1700 nm
空间分辨率:	< 1 μm
电动位移行程:	50 mm \times 50 mm \times 40 mm
扫描精度:	< 1 μm ，步进最小 0.04 μm
偏振控制:	电动
测量方式:	反射和透射
光路切换方式:	电动，软件控制
物镜组:	5X, 10X, 20X, 50X, 100X可见光物镜；反射式物镜，红外长焦物镜等可选
照明光源:	高显色LED面光源
光谱采集:	光纤光谱仪；光栅光谱仪（可选）
软件功能:	移动视场，切换物镜，对焦，框选扫描区域均可用鼠标直接在图像显示窗口操作；电动功率调整；自动光路模式切换；自动化Mapping；自动化偏振Mapping；实时处理与显示数据。

► 基本功能

- ◆ 白光反射谱及Mapping成像；
- ◆ 白光透射谱及Mapping成像；
- ◆ 电动变偏振采谱；（可选）
- ◆ 适配低温台、电学样品台等；（可选）
- ◆ 共聚焦方式和科勒照明方式；（可选）
- ◆ 透射光谱无色散设计；（可选）
- ◆ 入射及收集光路均可配置双口电动切换。（可选）

► 应用场景

光学材料的能级及振动强弱信息探测

- ◆ 半导体材料的带隙探测；
- ◆ 无机光学材料的吸收特性研究；
- ◆ 贵金属纳米材料的表面等离子体共振特性研究；
- ◆ 光学材料的基础光谱表征。